

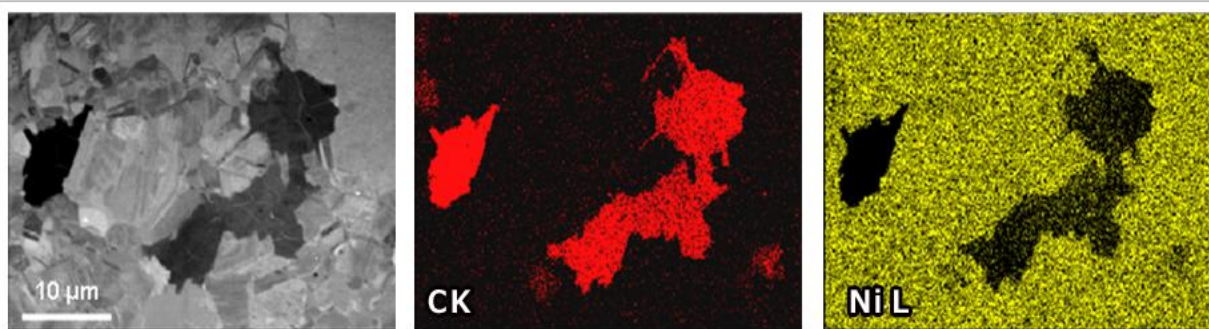
JSM-7610F快速低加速电压下的高分辨率元素分析

JSM-7610F配备了肖特基热场发射电子枪，因此可以获得很大的探针电流。下面是对各种样品的快速元素分析结果。

样品：镍基板上的石墨烯薄膜 加速电压：2 kV

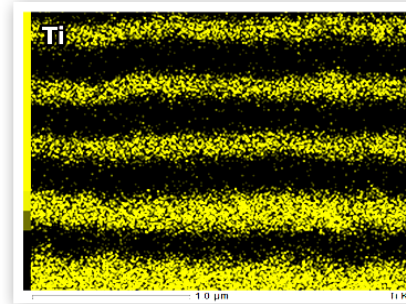
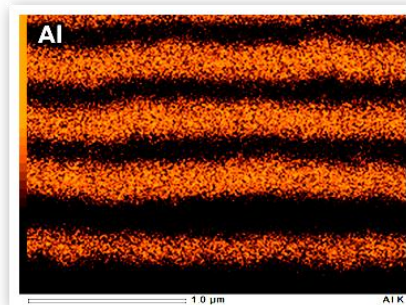
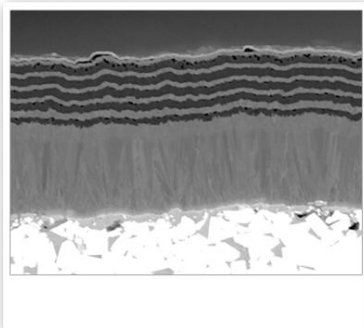
探针电流：10 nA

EDS检测器：30 mm²



利用7610F的特长—低加速电压下的大探针电流，进行了120秒的快速元素面分布测试。
能分析浅表面上极薄的石墨烯。

样品：硬质合金上的多层膜截面
加速电压：8 kV / 探针电流：38 nA
EDS检测器：10 mm²



样品制备：用CP制作截面

使用10 mm²的SDD检测器，在30秒的短时间内获得了元素面分布图。